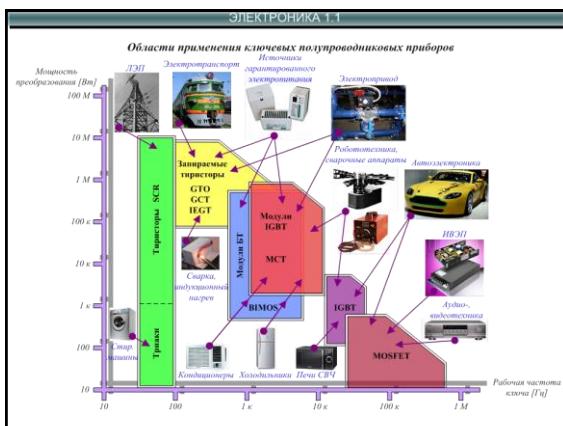




### ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

#### **Введение**

**Электроника** представляет собой обширную область техники, базирующуюся на изучении физических явлений в полупроводниках, диэлектриках, вакууме, газе, плазме и т. д. для создания на их основе разнообразных изделий с электронными компонентами.



**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1**

**Физические основы работы полупроводниковых приборов**

**Энергетические уровни и зоны**

**Разрешенные орбиты электрона в атоме водорода**

**Энергетические уровни атома водорода**

Уровень	Энергия
$n_\infty$	$E_\infty = 0$
$n_3$	$E = \frac{E_1}{9}$
$n_2$	$E = \frac{E_1}{4}$
$n_1$	$E_1 = -13.6 \text{ эВ}$

Полная энергия электрона, равная сумме его кинетической (движения по орбите) и потенциальной (притяжения к ядру) энергий, называется **энергетическим состоянием атома**.

Энергетические уровни могут быть **разрешенными** и **запрещенными**.

---

---

---

---

---

---

**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1**

**Проводники, полупроводники и диэлектрики**

**Принцип Паули:**

На любом энергетическом уровне одновременно может находиться **не более** двух электронов, отличающихся моментами импульса или спинами.

Энергия электрона

$\Delta W = 0 \text{ эВ}$  – проводники

$0,01 \leq \Delta W \leq 3 \text{ эВ}$  – полупроводники

$\Delta W > 3 \text{ эВ}$  – диэлектрики

Расщепление энергетических уровней электронов в твердых телах

---

---

---

---

---

---

**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1**

**Собственная электропроводность полупроводника**

**Структура связей атома кремния в кристаллической решетке**

---

---

---

---

---

---

ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Собственная электропроводность полупроводника

---



---



---



---



---



---

ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Электропроводность, обусловленную движением свободных электронов, называют **электронной**.

Электропроводность, обусловленную движением дырок – **дырочной**.

Электропроводность полупроводника, обусловленная парными носителями теплового происхождения, называется **собственной проводимостью**.

Процесс образования пары свободных носителей заряда «электрон – дырка» называют **генерацией пары**.

Процесс восстановления разорванных валентных связей называется **рекомбинацией**.

---



---



---



---



---



---

ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**Распределение электронов по энергетическим уровням**

**Уровень Ферми** – это такой энергетический уровень, вероятность нахождения на котором заряженной частицы равна 0,5 при любой температуре твердого тела.

$$f_n(W) = \frac{1}{1 + e^{\frac{W - W_F}{kT}}} \quad \text{– вероятность заполнения электроном энергетического уровня } W \text{ при температуре } T$$

$$f_p(W) = 1 - f_n(W) = \frac{1}{1 + e^{\frac{W_F - W}{kT}}} \quad \text{– вероятность того, что квантовое состояние с энергией } W \text{ свободно от электрона}$$


---



---



---



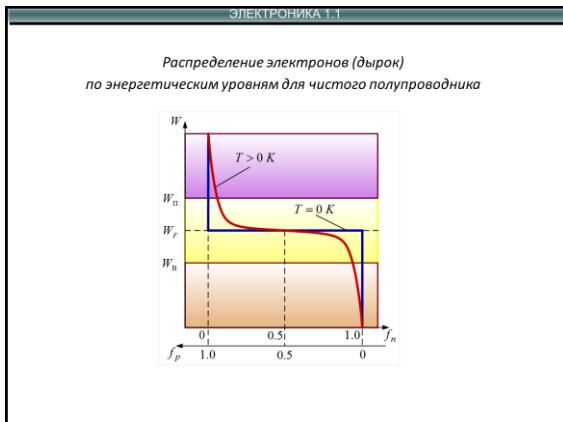
---



---



---




---

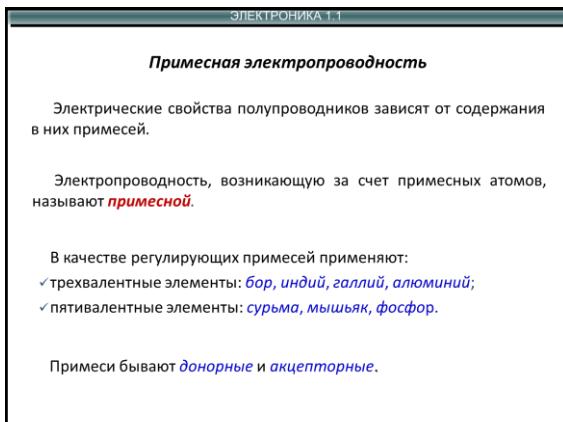
---

---

---

---

---




---

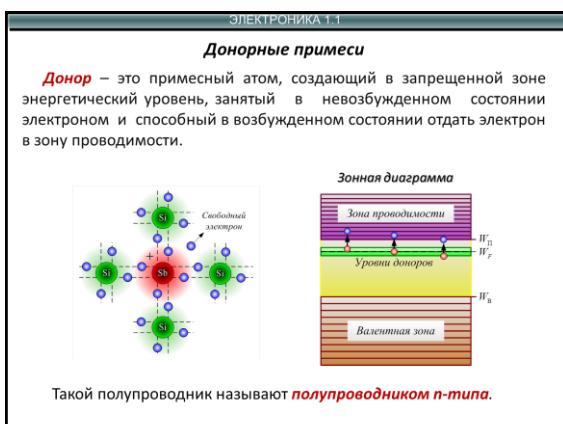
---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

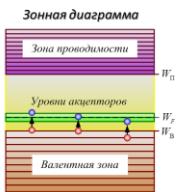
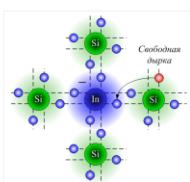
---

Такой полупроводник называют **полупроводником n-типа.**

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**Акцепторные примеси**

**Акцептор** – это примесный атом, создающий в запрещенной зоне энергетический уровень, свободный от электрона в невозбужденном состоянии и способный захватить электрон из валентной зоны в возбужденном состоянии.



Такой полупроводник называют **полупроводником р-типа**.

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**Процессы переноса зарядов в полупроводниках****Дрейф носителей заряда**

**Дрейфом** называют направленное движение носителей заряда под действием электрического поля.

Составляющая электрического тока в полупроводнике под действием внешнего электрического поля называется **дрейфовым током**

$$J = J_{n \text{ др}} + J_{p \text{ др}} = qE(N_n \mu_n + N_p \mu_p).$$

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**Диффузия носителей заряда**

**Диффузия** – движение носителей заряда из-за градиента концентрации, т.е. происходит выравнивание концентрации носителей заряда по объему полупроводника.

Поток частиц при диффузии  $\Phi_m = -D_m \text{grad}(m)$ .

$$J_{n \text{ диф}} = qD_n \frac{dn}{dx}, \quad J_{p \text{ диф}} = -qD_p \frac{dp}{dx},$$

$$J_{\text{диф}} = q \left( D_n \frac{dn}{dx} - D_p \frac{dp}{dx} \right).$$

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**Электрические переходы**

**Электрическим переходом** в полупроводнике называется граничный слой между двумя областями, физические характеристики которых имеют существенные физические различия.

Виды электрических переходов:

- ✓ **электронно-дырочный, или p-n-переход;**
- ✓ **переход металла – полупроводник;**
- ✓ **переходы между двумя областями с одним типом электропроводности, отличающиеся значением концентрации примесей;**
- ✓ **гетеропереходы.**

---

---

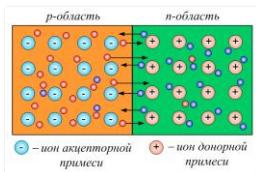
---

---

---

---

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**Электронно-дырочный переход**


---

---

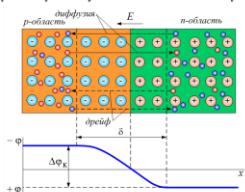
---

---

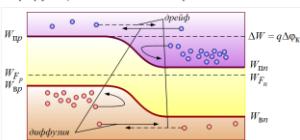
---

---

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**P-n-переход при отсутствии внешнего напряжения**

Зонная энергетическая диаграмма p-n-перехода, иллюстрирующая баланс токов в равновесном состоянии




---

---

---

---

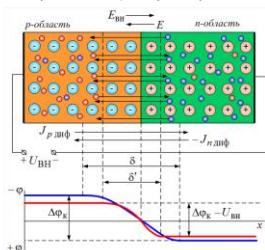
---

---

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

**Вентильное свойство p-n-перехода**

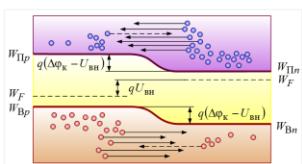
*p-n*-переход, обладает свойством изменять свое электрическое сопротивление в зависимости от направления протекающего через него тока. Это свойство называется **вентильным**.

**Прямое смещение *p-n*-перехода**

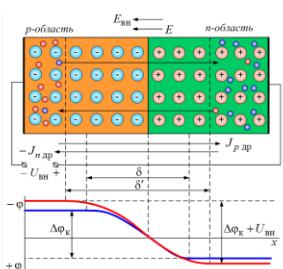
## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Введение носителей заряда через *p-n*-переход при понижении высоты потенциального барьера в область полупроводника, где эти носители являются неосновными, называют **инжеекцией носителей заряда**.

Зонная энергетическая диаграмма прямого смещения *p-n*-перехода, иллюстрирующая дисбаланс токов

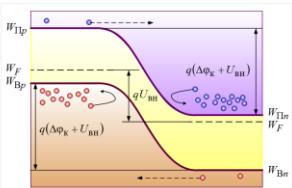


## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

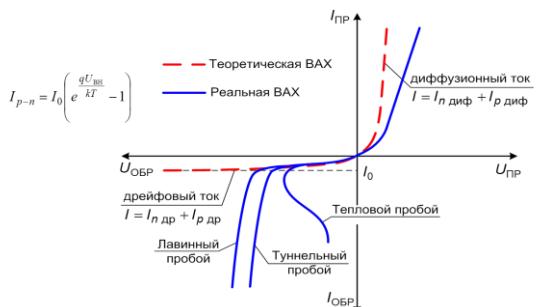
**Обратное смещение *p-n*-перехода**

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Зонная энергетическая диаграмма обратного смещения  $p-n$ -перехода, иллюстрирующая дисбаланс токов



## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Вольт-амперная характеристика  $p-n$ -перехода

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Виды пробоев  $p-n$ -перехода

Возможны обратимые и необратимые пробои.

**Обратимый пробой** – это пробой, после которого  $p-n$ -переход сохраняет работоспособность.

**Необратимый пробой** ведет к разрушению структуры полупроводника.

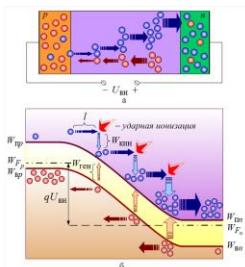
Существуют четыре типа пробоя: **лавинный, туннельный, тепловой и поверхностный**.

Лавинный и туннельный пробои объединяются под названием – **электрический пробой**, который является обратимым.

К необратимым относят тепловой и поверхностный.

**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1****Лавинный пробой**

Происходит в полупроводниках, со значительной толщиной  $p-n$ -перехода под действием сильного электрического поля.

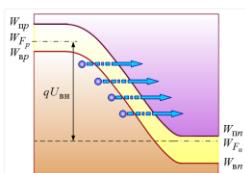


*a – распределение токов; б – зонная диаграмма, иллюстрирующая лавинное умножение при обратном смещении  $p-n$ -перехода*

**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1****Туннельный пробой**

Происходит в **очень тонких**  $p-n$ -переходах и при **небольших значениях обратного напряжения** (несколько вольт), когда возникает большой градиент электрического поля.

Зонная энергетическая диаграмма туннельного пробоя  $p-n$ -перехода при обратном смещении

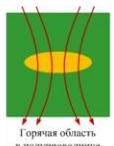
**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1****Тепловой пробой**

В режиме постоянного тока мощность рассеяния, подводимая к  $p-n$ -переходу определяется как

$$P_{\text{расс}} = U_{\text{обр}} I_{\text{обр}}.$$

Для предотвращения теплового пробоя необходимо выполнение условия

$$P_{\text{расс}} = U_{\text{обр}} I_{\text{обр}} < P_{\text{расс max}}.$$

**Шнурование электрического тока**

Горячая область в полупроводнике



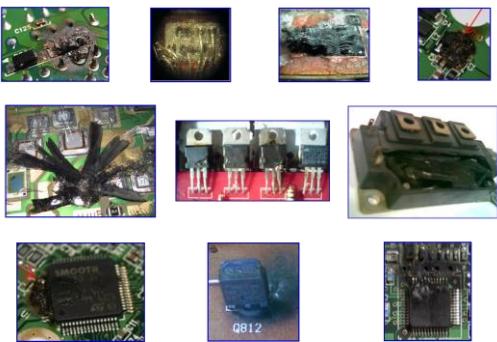
Электрический ток в полупроводнике



Зелено-желтая область – результат выброса расплавленного кремния

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Последствия теплового пробоя в полупроводниковых приборах




---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

## Емкость p-n-перехода

Емкость p-n-перехода разделяют на две составляющие:

- ✓ **барьерную**, отражающую перераспределение зарядов в p-n-переходе.
- ✓ **диффузионную**, отражающую перераспределение зарядов вблизи p-n-перехода.

---

---

---

---

---

---

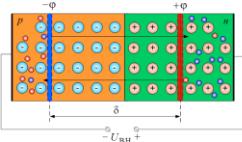
---

---

---

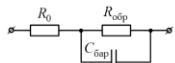
## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

## 1. Барьерная емкость



При постоянном напряжении

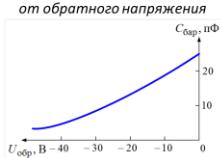
$$C_b = \frac{Q_{обр.}}{U_{обр.}}$$

Барьерная емкость  $C_b$  определяется как:

$$C_b = C_0 \sqrt{\frac{\Delta\Phi_K}{\Delta\Phi_K - U_{обр}}}.$$

$$C_0 = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{\delta}.$$

Зависимость барьерной емкости от обратного напряжения




---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1**

### 2. Диффузионная емкость

При постоянном напряжении

$$C_{\text{диф}} = \frac{Q_{\text{диф}}}{U_{\text{пп}}}$$


---

---

---

---

---

---

**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1**

### Контакт металл – полупроводник

**Контакт металл – полупроводник** возникает в месте соприкосновения полупроводникового кристалла *p* или *n*-типа проводимости с металлами.

В месте контакта происходит перераспределение электрических зарядов и возникает электрическое поле и контактная разность потенциалов:

$$\Delta\varphi_k = \left| \frac{A_M - A_n}{q} \right|.$$


---

---

---

---

---

---

**ЭЛЕКТРОНИКА 1.1**

### Контакт «металл – полупроводник», не обладающий выпрямляющим свойством

### Контакт «металл – полупроводник», обладающий выпрямляющим свойством

---

---

---

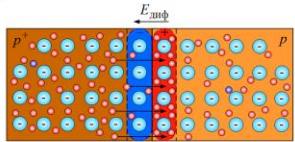
---

---

---

## ЭЛЕКТРОНИКА 1.1

Контакт между полупроводниками одного типа проводимости



Такой контакт **не обладает** выпрямляющим свойством

---

---

---

---

---

---